04;10 Электрические и оптические характеристики наносекундного разряда с щелевым катодом, ограниченного диэлектрическими стенками

© Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, В.С. Кобзев, О.В. Кобзев

Дагестанский государственный университет, Maxaчкала E-mail: nashurb@mail.ru

Поступило в Редакцию 10 мая 2007 г.

Экспериментально исследованы электрические и оптические характеристики ограниченного диэлектрическими стенками поперечного наносекундного разряда с щелевым катодом в гелии в диапазоне давлений газа 1–100 Тогг. Показано, что величина плотности катодного тока многократно (на порядки) превышает плотность анодного тока для аномально тлеющего разряда. Установлена связь между характерными временами релаксации оптического излучения и быстрым диффузионным остыванием электронного газа после скачка пристеночного потенциала.

PACS: 52.40.Mj

В последнее время значительный интерес проявляется к созданию и исследованию плазменно-пучковых разрядов (ППР), где в процессе электрического пробоя газа формируется пучок быстрых электронов с энергией от нескольких сотен keV [1,2]. Для получения ППР используются как продольная, так и поперечная схемы импульсного разряда. Наиболее перспективным с точки зрения практических приложений является схема с поперечным наносекундным разрядом, где требуются меньшие значения рабочих напряжений [3]. Несмотря на успешное применение ППР для накачки активных сред газовых лазеров [4,5] и для получения сильноточных электронных и ионных пучков в различных инжекторах [6], физика таких разрядов выяснена недостаточно и требует дальнейшего изучения.

В данном сообщении приведены результаты экспериментального исследования электрических и оптических характеристик ограниченного

17

диэлектрическими стенками наносекундного ППР с щелевым катодом с поперечной схемой возбуждения.

Исследуемый разряд происходил между двумя алюминиевыми электродами длиной 40 cm и расстоянием между ними 0.6 cm, расположенными в цилиндрической трубке из молибденового стекла диаметром 5 cm и длиной 50 cm. Катод представлял собой круглый стержень диаметром 1 cm с прорезом вдоль него шириной 0.2 cm и глубиной 0.6 cm. Анод имел плоскую форму в виде прямоугольной пластины шириной 2 cm и толщиной 0.5 cm. Разряд с помощью пластины текстолита ограничивался с двух сторон, свободных от электродов, и занимал объем (включая полость в катоде) шириной 1.2 cm, толщиной 0.2 cm и длиной 40 cm. Подробное описание экспериментальной установки, генератора импульсов напряжения (ГИН) и системы регистрации приведено в [3,7].

Были выполнены систематические экспериментальные исследования электрических и оптических характеристик и пространственной динамики оптического излучения разряда в зависимости от величины напряжения на разрядном промежутке (U_0) и давления газа (p) в камере. Все измерения проводились в режиме непрерывного протока через камеру рабочего газа (гелий).

Из рис. 1 видно, что на осциллограмме напряжения горения (U_{br}) наблюдаются два максимума. При увеличении значений U_0 от 1 до 5 kV значение первого максимума на U_{br} увеличивается примерно в два раза, от 1200 до 2500 V, а значение второго максимума при этом остается практически постоянным и составляет величину порядка 700 V. В этих условиях на осциллограмме разрядного тока (I_{br}) наблюдаются три максимума (рис. 1, *a*). При увеличении значений U_0 первый максимум на I_{br} смещается в сторону второго максимума и при $U_0 \ge 2$ kV сливается с ним. При этом одновременно быстро увеличиваются амплитуды второго (I_2) и третьего (I_3) максимумов тока, причем третий максимум на I_{br} растет быстрее и при $U_0 > 4.5$ kV сравнивается по амплитуде со вторым максимумом (рис. 1, *b*).

Систематические исследования пространственно-временной динамики формирования оптического излучения ограниченного разряда в гелии в зависимости от значений p и U_0 показали, что пространственная структура и интенсивность оптического излучения в щели катода и в промежутке между электродами существенно зависят от значений pи U_0 . При значениях p < 30 Torr и $U_0 < 2.5$ kV интенсивность излучения



Рис. 1. Характерные осциллограммы напряжения горения и разрядного тока на электродах при p = 10 Тогг и различных начальных значениях U_0 , kV: a - 1.5; b - 4.5.

из щели катода больше, чем из ограниченной области между электродами (рис. 2, *a*). При p > 30 Тогг с ростом величины $U_0 > 3$ kV, наоборот, интенсивность излучения из ограниченной области между электродами становится заметно выше, чем из щели катода (рис. 2, *b*).



Рис. 2. Характерные картины пространственного распределения оптического излучения разряда: a - p = 10 Torr, $U_0 = 1.5$ kV; b - p = 45 Torr, $U_0 = 3$ kV.

В работе также исследовался временной ход интегральной интенсивности оптического излучения разряда, регистрируемой с помощью специальной диафрагмы из различных областей по центру разрядного промежутка (рис. 3). Экспериментальные исследования показали, что форма импульса, интенсивность и длительность оптического излучения зависят от значений U_0 , p и расстояния от электродов. Из рис. 3 видно, что осциллограмма интенсивности оптического излучения из области, расположенной на расстоянии 4 mm от поверхности анода, имеет два характерных времени релаксации оптического излучения.

Изучение вольт-амперных характеристик (ВАХ) и их временной эволюции является важнейшим методом исследования механизма функционирования ППР с щелевым катодом. Из рис. 1, *a* и *b* видно, что ВАХ ограниченного ППР с щелевым катодом имеют необычный вид. В данной работе используется ГИН, собранный по схеме Блюмляйна, и в качестве накопителя энергии применяется блок малоиндуктивных конденсаторов КВИ-3. В такой электрической цепи неизбежно имеется индуктивность, и характеристики разряда зависят от степени нелинейности и емкости. Характерное время изменения напряжения на электродах $\tau_1 = RC$ и характерное время нарастания тока $\tau_2 = 2L/R$,

где R — активное сопротивление разрядного промежутка, C — емкость накопительного элемента, L — индуктивность электрической цепи. Для условий данной работы $R \sim 1 \div 25 \Omega$, $C \sim 2 \cdot 10^{-8}$ F, минимальная индуктивность $\sim 10^{-7}$ Н. Видно, что при малых значениях $R \leqslant 4 \Omega$ $\tau_2 > \tau_1$ и в первый момент включения тиратрона должен произойти спад напряжения на электродах с характерным временем т₁ и последующий подъем со временем т₂. Появление второго максимума на осциллограмме U_2 при $U_0 > 1.5 \,\mathrm{kV}$ (рис. 1, b) связано с изменением параметров электрической цепи, что приводит к выполнению условия $\tau_2 > \tau_1$. На начальных стадиях импульса тока при условиях $U_0 < 2 \,\mathrm{kV}$ основному импульсу с двумя максимумами предшествует кратковременный пик длительностью до 10 ns (рис. 1, a). Амплитуда этого импульса на порядок превосходит амплитуду емкостного тока смещения и достигает до 25 А. Выполненные ранее в работе [8] детальные исследования начальных стадий пробоя газа показали, что амплитуда кратковременного пика, предшествующего основному импульсу тока, уменьшается с увеличением диаметра разрядной трубки, увеличением температуры стенок, а также зависит от материала электродов. Дополнительно проведенные в этой же работе экспериментальные исследования tg δ-диэлектрических потерь материала стенок трубки после облучения электронным пучком показали, что релаксационные процессы осажденного на диэлектрике заряда длятся десятки минут. По-видимому, с переносом заряда, осажденного на диэлектрические ограничители из текстолита, связан первый кратковременный пик на осциллограмме импульса тока, наблюдаемый и в данной работе. Анализ осциллограмм тока и сопоставление их с оптическими картинами интегрального свечения разряда показывают, что второй максимум тока связан с сильноточной фазой разряда, возникающей за счет проникновения плазмы внутрь щели катода. С ростом величины U₀ плотность плазмы в щели катода многократно возрастает, и она начинает играть роль плазменного катода, который становится основным эмиттером электронов для I₂, что приводит к увеличению величины I₂ более чем на порядок. При высоких значениях U₀ на накопительном конденсаторе ГИН проникновение разряда внутрь щели может иметь осциллирующий характер, что приводит к появлению третьего максимума тока.

В таблице приведены плотности тока разряда на катоде j_{k2} и j_{k3} , соответствующие максимумам тока I_2 и I_3 (рис. 1, a и b). Там же

Рис. 1	j_{k2} , A/cm ²	j_{a2} , A/cm ²	j_{k3} , A/cm ²	j_{a3} , A/cm ²	j_{k2}/j_{a2}	j_{k3}/j_{a3}	ε, eV	Λ,cm
а	3.21	0.18	1.34	0.05	18	27	940	1.9
b	8.93	0.25	8.21	0.016	36	514	1100	2.4

приведены и плотности тока j_{a2} и j_{a3} для аномально тлеющего разряда (ATP), рассчитанные при значениях напряжения горения U_{br} в момент максимумов тока I_2 и I_3 по формуле

$$j_a/p^2 = 2.5 \cdot 10^{-12} U_k^3$$

где вместо U_k подставлялись значения U_{br}.

Из таблицы видно, что значения j_{k2} и j_{k3} более чем на порядок превосходят значения j_{a2} и j_{a3} , и это отличие тем больше, чем больше значение U_0 , и достигает для j_{k3}/j_{a3} до 500 при $U_0 = 4.5$ kV. Это отличие ВАХ ППР с щелевым катодом от ВАХ АТР обусловлено эффектом полого катода и геометрией разрядного промежутка. Столь существенное отличие j_k от j_a можно использовать для получения больших токов при фиксированном значении U_0 . Оценки концентрации электронов в разрядном промежутке при p = 10 Torr, плотности тока j = 65 A/cm² и $E = 2.5 \cdot 10^3$ V/cm по формуле

$$n_e = j/ev_{dr}$$

где e — заряд электрона, $v_{dr} = 10^6 + 7.6 \cdot 10^5 E/p$ [9] дают значения $n_e \sim 10^{13} \,\mathrm{cm^{-3}}$.

Для условий данной работы длина свободного пробега электронов по отношению к неупругим процессам намного больше размера области катодного падения потенциала (КПП) [7], следовательно, электроны, эмитируемые с поверхности катода, область КПП проходят без столкновений и приобретают энергию $\varepsilon = eU_k$. При оценке значений ε величина U_k бралась равной $U_{br}/2$, что справедливо для условий данной работы. Длины пробега этих ускоренных электронов в плазме оценивались по формуле [2]

$$p\Lambda = 6.5 \cdot 10^{-4} (eU_k)^{1.54}$$

Полученные значения є и Λ приведены в таблице. Оценки показывают, что часть ускоренных электронов достигает поверхности анода



Рис. 3. Осциллограмма импульса свечения по центру разряда на расстоянии 0.4 cm от анода при p = 10 Torr и $U_0 = 4.5$ kV.

и характер энергетической релаксации этих электронов оказывает существенное влияние на динамику развития и структуру оптического излучения исследуемого разряда.

Наблюдаемые в эксперименте два характерных времени релаксации оптического излучения (рис. 3) связаны с особенностями влияния пристеночных процессов на релаксацию функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ). Режим формирования ФРЭЭ можно анализировать путем введения параметра релаксации [10]

$$k(\varepsilon) = (\nu_e + \delta \nu_a + \nu^*)\tau_r,$$

где v_e — частота межэлектронных столкновений; $\delta = \frac{2m}{M}$; M — масса атома; v_a — частота упругих столкновений электронов с атомами; v^* — частота неупругих столкновений электронов с атомами; τ_r — время ухода электронов на стенки разрядной камеры.

В условиях данной работы поток электронов на стенку ограничителя Γ_e состоит из потока основной группы электронов Γ_{em} и потока быстрых электронов $\Gamma_{e\delta}\Gamma_e = \Gamma_{em} + \Gamma_{e\delta}$. Если $k(\varepsilon) \gg 1$, то быстрые электроны релаксируют по энергиям в объеме и величина пристеночного потенциала (ΔU) определяется из равенства $\Gamma_i = \Gamma_{em}$, где Γ_i — поток ионов на стенку ограничителя. При $k(\varepsilon) \ll 1$, если $e\Delta U < \varepsilon_{\delta}$ быстрые электроны с энергией ε_{δ} в режиме свободной

диффузии уходят на стенки ограничителей, что приводит к изменению величины ΔU. Для оценки влияния диффузии быстрых электронов на ΔU введем параметр диффузии [11] $\gamma = \Gamma_{e\delta}/\Gamma_i$. Если $\gamma < 1$, то диффузия быстрых электронов практически не оказывает влияния на величину ΔU . Если же $\gamma > 1$, то ΔU становится порядка $\bar{\epsilon}_{\delta}/e$, быстрые электроны запираются в объеме и их уход из этой области энергий определяется столкновительными процессами в объеме, что приводит к образованию сплошного электронного спектра, как и при $k(\varepsilon) \ll 1$. Сразу после формирования катодного слоя у принимает максимальное значение и в дальнейшем падает, поскольку с течением времени уменьшаются как средняя энергия $\bar{\varepsilon}_{\delta}$, так и относительная доля быстрых электронов $N_{e\delta}/N_i$. Отметим, что в ППР с щелевым катодом при $k(\varepsilon) \ll 1$ с течением времени условие $\gamma > 1$ может смениться условием $\gamma < 1$, что может привести к скачкообразному уменьшению величины ΔU . Оценки для условий данной работы $R = 0.2 \, \text{cm}, p = 10 \, \text{Torr}$ и средней энергии электронов $\varepsilon = 4 \, \text{eV}$ дают величину $k(\varepsilon) \sim 0.1 \ll 1$ и величину $\gamma \sim 10^3 N_{e\delta}/N_i$.

Таким образом, в первые моменты после формирования катодного слоя, при доле быстрых электронов 0.1% и выше $\gamma > 1$. В дальнейшем, по мере релаксации быстрой части ФРЭЭ, условие $\gamma > 1$ может смениться обратным соотношением $\gamma < 1$, что приводит к скачкообразному уменьшению величины ΔU с $\bar{\epsilon}_{\delta}/e$ до $\bar{\epsilon_m}/e$. При этом в режиме свободной диффузии быстрые электроны уходят на стенки разрядной камеры. Это приводит к быстрому остыванию электронного газа после скачка пристеночного потенциала. По-видимому, этим и объясняется наличие двух характерных времен релаксации оптического излучения, наблюдаемых в эксперименте (рис. 3).

Таким образом, полученные в настоящей работе результаты показывают, что j_k наносекундного ограниченного ППР с щелевым катодом при некоторых условиях более чем на два порядка превышает величину j_a . При этом в разряде формируются пучки ускоренных электронов с энергией до 1 keV и релаксация этих электронов по энергиям оказывает существенное влияние на динамику развития и структуру оптического излучения. Наблюдаемые в эксперименте два характерных времени релаксации оптического излучения связаны запиранием в объеме быстрых электронов при $\Delta U = \bar{\epsilon}_{\delta}/e$ и быстрым диффузионным остыванием электронного газа после скачка пристеночного потенциала.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке фонда РФФИ, проект № 07-02-00506-а.

Список литературы

- [1] Тарасенко В.Ф., Яковленко С.И. // УФН. 2004. Т. 174. № 9. С. 953–971.
- [2] Сорокин А.Р. // ЖТФ. 2006. Т. 76. В. 5. С. 47–55.
- [3] Ашурбеков Н.А., Иминов К.О. // ТВТ. 1998. Т. 36. № 3. С. 368–373.
- [4] Ашурбеков Н.А., Иминов К.О. // Оптика и спектроскопия. 1990. Т. 68. В. 1. С. 48–51.
- [5] *Орешкин В.Ф., Серегин А.М., Синайский В.В.* и др. // Квантовая электроника. 2003. Т. 33. № 12. С. 1043–1046.
- [6] Завьялов М.А., Крейндель Ю.Е., Новиков А.А. и др. Плазменные процессы в технологических электронных пушках. М.: Энергоатомиздат, 1989. 256 с.
- [7] Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Кобзева В.С. и др. // Изв. вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2006. № 3. С. 16–19.
- [8] Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Омаров О.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2000. Т. 56. № 7. С. 1353–1360.
- [9] Ретер Г. Электронные лавины и пробой в газах. М.: Мир, 1968. 390 с.
- [10] Цендин Л.Д., Голубовский Ю.Б. // ЖТФ. 1977. Т. 47. № 9. С. 1839–1845.
- [11] Демидов В.И., Колоколов Н.Б., Торонов О.Г. // Физика плазмы. 1986. Т. 12.
 В. 6. С. 702–708.